

SrTiO₃(001)衬底上单层FeSe超导薄膜的分子束外延生长*

王萌¹⁾³⁾ 欧云波³⁾ 李坊森²⁾³⁾ 张文号²⁾³⁾ 汤辰佳²⁾³⁾ 王立莉²⁾³⁾
薛其坤^{2)†} 马旭村^{2)3)‡}

1) (北京邮电大学电子工程学院, 北京 100876)

2) (清华大学, 低维量子物理国家重点实验室, 北京 100084)

3) (中国科学院物理研究所, 表面物理国家重点实验室, 北京 100190)

(2013年12月1日收到; 2013年12月11日收到修改稿)

在以前工作的基础上, 进一步研究了SrTiO₃(001)(STO)衬底上单层FeSe超导薄膜的分子束外延生长。首先, 通过去离子水刻蚀、盐酸溶液腐蚀和纯氧气氛中退火等步骤, 获得台阶有序、具有单一TiO₂终止的原子级平整表面的STO衬底, 这是前提条件。这个过程中酸的选择和退火过程中氧的流量是最为关键的因素。其次, 在FeSe薄膜的分子束外延生长中, 选择适当的Fe源和Se源束流以及衬底温度是关键因素。如选择适当, 生长模式为step-flow生长, 这时得到的FeSe薄膜将是原子级平整的。最后一步为退火, 这个过程会增强FeSe薄膜结晶性以及它与SrTiO₃衬底间的结合强度。

关键词: SrTiO₃(001), 单层FeSe薄膜, 高温超导, 分子束外延

PACS: 74.78.-w, 77.80.bn, 68.35.Ct

DOI: 10.7498/aps.63.027401

质量, 从而制备出适合输运研究的样品。

1 引言

最近我们的扫描隧道显微镜研究显示, 外延于STO衬底的单层FeSe薄膜具有20 meV超导能隙^[1]; 角分辨光电子谱研究也观测到类似大小的超导能隙, 并且直到65 K才消失^[2], 预示着外延于STO衬底上的单层FeSe薄膜有可能打破铁基超导转变温度记录(55 K)^[1]。这似乎验证了50多年前已被提出的界面超导理论^[3,4]。众所周知, 超导的两个基本特征是零电阻和迈斯纳效应。要证明STO衬底上的薄膜是否是超导, 最终需要宏观的输运测量才能验证, 这要求我们能够制备出大面积连续的单层FeSe薄膜。在前期工作的基础上^[1,5], 本文主要从SrTiO₃(001)衬底处理以及FeSe薄膜的分子束外延生长等方面讨论如何改进FeSe薄膜的

2 单一TiO₂终止SrTiO₃(001)表面的处理方法

SrTiO₃具有标准的钙钛矿(ABO₃)结构(如图1), 在105 K时发生结构转变, 由原来的立方相转变为四方相^[6,7]。SrTiO₃(001)面的晶格常数为3.905 Å, 稍大于FeSe体相的晶格常数(3.765 Å), 两者晶格失配度约为3%。沿(001)方向, TiO₂层与SrO层交替堆垛, TiO₂-TiO₂面间距为0.4 nm。利用电输运测量FeSe单晶薄膜包括界面的输运性质要求衬底具有良好的绝缘性, 以便降低来自衬底的信号贡献。因此, 我们选用本征无掺杂的SrTiO₃(001)作为衬底。为了生长高质量的单层FeSe单晶薄膜, 必须先制备出原子级平整、单一

* 国家自然科学基金(批准号: 11374336, 91121004)资助的课题。

† 通讯作者。E-mail: qkxue@mail.tsinghua.edu.cn

‡ 通讯作者。E-mail: xcma@iphy.ac.cn

TiO_2 终止的 $\text{SrTiO}_3(001)$ 表面。目前，单一 TiO_2 终止面的 $\text{SrTiO}_3(001)$ 制备方法^[8–10] 已经发展得比较成熟，最常用的方法是利用 HF 处理 STO 衬底^[11]。我们发现由此方法很容易获得表面台阶有序并且具有单一 TiO_2 终止面的 STO(001) 表面（图 2(a)），但沉积于此种表面的 FeSe 多形成团簇，结晶性差，如图 2(b) 所示。可能原因是 HF 腐蚀过程中，部分 F 离子替代表面的氧离子^[12]，并由此导致 FeSe 在此表面的成核不均匀。

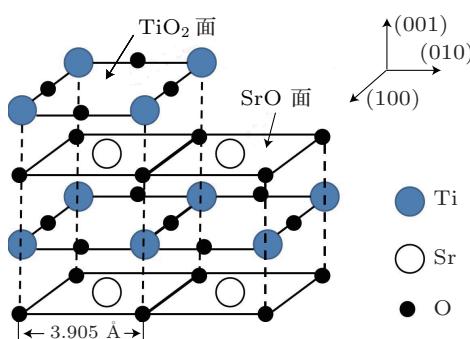


图 1 SrTiO_3 衬底的结构示意图

本研究中，我们利用 HCl 腐蚀处理 STO 衬

底。具体过程包含以下三个步骤：1) 将绝缘 $\text{SrTiO}_3(001)$ 衬底放入 80 °C 的去离子水中 60 min。此过程中，衬底表面的 SrO 层将充分水解，生成碱性氧化物 $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 。2) 再将其放入体积分数约为 10% 的盐酸溶液中腐蚀 45 min，使表面生成的 $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 与盐酸充分反应，去除表面的 SrO 层。3) 将盐酸腐蚀后的衬底放入管式炉中，在纯氧的气氛下，将样品加热至 980 °C 退火 3 h 后，缓慢降至室温。步骤 3) 中，退火过程中氧流量是获得单一 TiO_2 终止 $\text{SrTiO}_3(001)$ 表面的关键因素，影响着 STO 表面上 SrO 面与 TiO_2 面分布。通过精确调控氧流量，能够获得单一 TiO_2 终止面的 STO 衬底。如图 3(a) 所示，氧流量为 30.0 ml/min 时，获得的 STO 衬底具有双终止面，即 TiO_2 面和 SrO 面共存，表面台阶附近存在少量的 SrO 面。图 3(b) 是(a) 图中沿 AB 扫描线得到的高度变化，相邻 SrO 面与 TiO_2 面的高度差约为 0.2 nm。将氧流量提高至 38.5 ml/min 时（如图 3(c) 所示），SrO 面大大减少，得到了近乎单一 TiO_2 终止的 STO(001) 表面，并且表面起伏不高于 60 pm，这样的表面是原子级平整的表面。以此原子级平整、单一 TiO_2 终止的

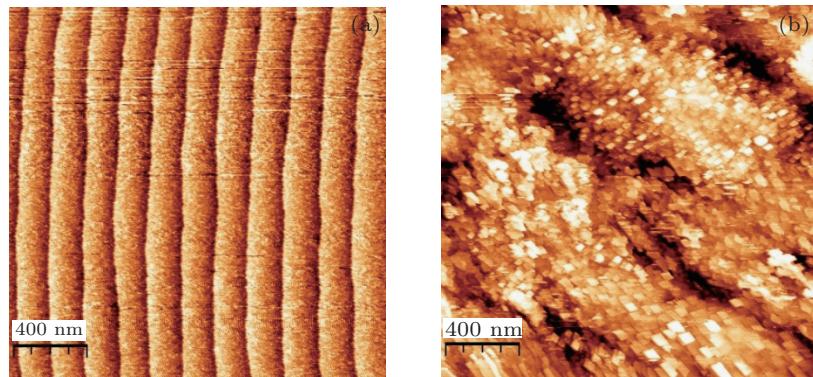


图 2 (a) 经 HF 处理后的 $\text{SrTiO}_3(001)$ 表面扫描隧道显微镜 (STM) 形貌像 (图像大小: 2 $\mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$, 扫描条件: $V_{\text{bias}} = 3.0 \text{ V}$, $I_t = 60 \text{ pA}$); (b) 在该衬底上生长 5 层 FeSe 薄膜的表面 STM 形貌像 (图像大小: 2 $\mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$, 扫描条件: $V_{\text{bias}} = 2.0 \text{ V}$, $I_t = 60 \text{ pA}$)

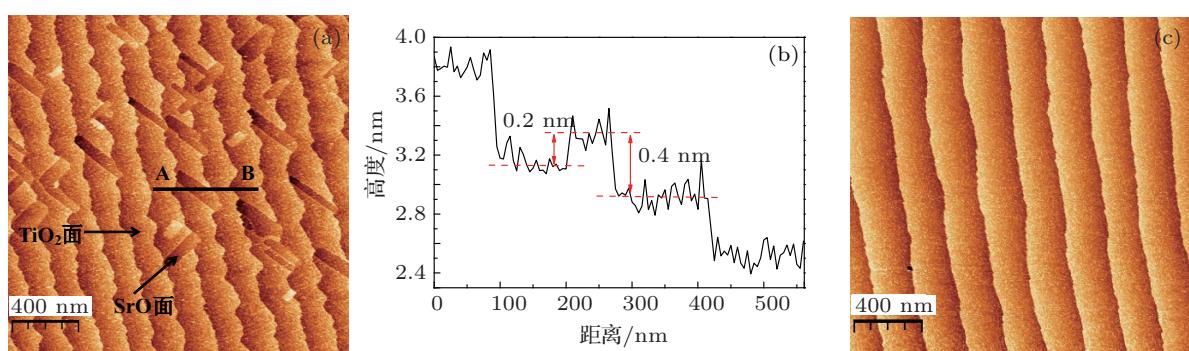


图 3 (a) 氧流量为 30.0 ml/min 时 STO 衬底表面的 STM 形貌像 (图像大小: 2 $\mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$, 扫描条件: $V_{\text{bias}} = 1.5 \text{ V}$, $I_t = 60 \text{ pA}$); (b) 图 (a) 中沿 AB 扫描线得到的高度变化示意图; (c) 氧流量为 38.5 ml/min 时 STO 衬底表面的 STM 形貌像 (图像大小: 2 $\mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$, 扫描条件: $V_{\text{bias}} = 1.8 \text{ V}$, $I_t = 60 \text{ pA}$)

STO(001) 表面作为外延生长单层 FeSe 薄膜的衬底。

3 FeSe 薄膜的分子束外延生长

FeSe 薄膜的生长采用标准分子束外延方法：同时加热放置于标准源炉 (K-Cell) 中的高纯 Fe 源 (纯度为 99.99%) 和 Se 源 (纯度为 99.9999%)，使 Fe 与 Se 的束流比约为 1 : 10，并将 STO 衬底加热到高于 Se 源温度但低于 Fe 源温度的某一温度。在此条件下，Se 束流远高于 Fe 束流，富 Se 的生长条件保证了 FeSe 薄膜的化学配比，而衬底温度高于 Se 源温度，有助于富余的 Se 从衬底表面脱附。这种情形下，FeSe 薄膜的生长速率由 Fe 源的束流决定。实验中采用的 Fe 源、Se 源和衬底的具体温度分别为 1130, 148 和 390 °C。在此温度下，FeSe 薄膜的生长速率为 0.18 UC/min (单位原胞/分钟)。我们发现，FeSe 薄膜的具体形貌与台阶宽度和 Fe, Se, STO 衬底三者之间的温度都有直接关系，能够生长出连续单层 FeSe 薄膜的温度窗口很小。以台阶宽

度为 150 nm ± 50 nm 的 STO 衬底为例，若设定 Fe 源和 Se 源温度分别为 1130 °C 和 148 °C，能够获得连续单层 FeSe 薄膜的 SrTiO₃(001) 衬底温度为 390 °C ± 20 °C。图 4 为在此温度窗口内制备的大面积平整的单层 FeSe 薄膜的 STM 形貌像。STM 线扫描显示出规则台阶高度为 0.4 nm，与单一终止面 STO 衬底上的台阶高度一致，说明单层 FeSe 薄膜如同地毯一般均匀平铺于 STO 表面。台阶处存在的零散小岛是富余的第二层 FeSe 薄膜，其与第一层薄膜的台阶高度差是 0.55 nm，与体相 FeSe(001) 面间距 (0.5518 nm) 一致。衬底温度过高将会导致 FeSe 薄膜的跨台阶扩散，进一步沉积时会导致不同厚度薄膜的堆垛 (图 5(a))。高于 500 °C 的衬底温度会导致 FeSe 薄膜的分解/破裂。当衬底温度偏低时，Fe 原子在 STO 衬底表面的迁移变弱，并且由于台阶处较高的 ES 势垒以及 FeSe 薄膜与衬底间 3% 的晶格失配，会导致 FeSe 薄膜在台阶边缘不连续 (图 5(b))；更低的衬底温度将导致岛状生长，使 FeSe 薄膜形成大量的螺位错。

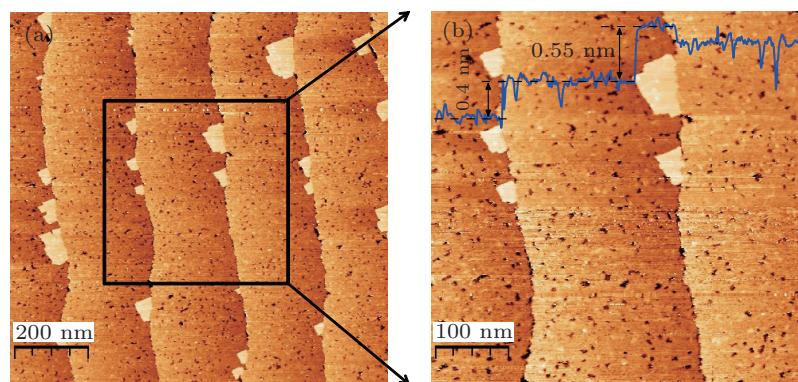


图 4 (a) 大面积平整的单层 FeSe 薄膜的 STM 表面形貌像 (图像大小 1 μm × 1 μm, 扫描条件 $V_{bias} = 2.0$ V, $I_t = 60$ pA); (b) 为放大 (a) 图方框内的单层 FeSe 薄膜的 STM 表面形貌像, 其中扫描线显示出台阶高度 (图像大小 500 nm × 500 nm, 扫描条件 $V_{bias} = 2.0$ V, $I_t = 60$ pA)

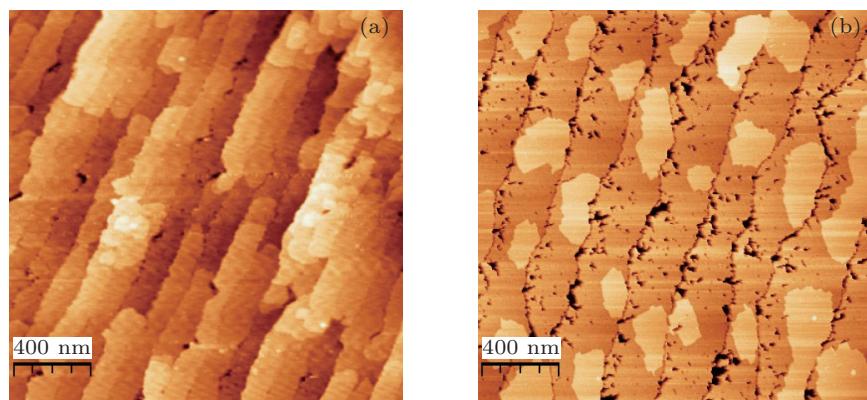


图 5 (a) 430 °C 衬底温度下获得的 FeSe 薄膜 STM 表面形貌像，薄膜跨台阶扩散 (图像大小 2 μm × 2 μm, 扫描条件 $V_{bias} = 1.5$ V, $I_t = 60$ pA); (b) 360 °C 衬底温度下获得的 FeSe 薄膜 STM 表面形貌像，薄膜在台阶边缘不连续 (图像大小 2 μm × 2 μm, 扫描条件 $V_{bias} = 2.0$ V, $I_t = 60$ pA)

要获得单层超导 FeSe 薄膜, 还需要进行退火。通过对 FeSe 薄膜进行后期退火可以进一步提高 FeSe 薄膜的致密度和连续性。图 6 为将图 4(b) 所示的 FeSe 薄膜在超高真空中加热到 430°C 并退火 12.5 h 后的表面形貌像。FeSe 薄膜的表面缺陷减少, 结晶性增强。如图 6(b) 所示的原子分辨形貌像, FeSe 薄膜的面内晶格常数为 0.385 nm , 比体相 FeSe(001) 的面内晶格 0.3765 nm 稍大, 说明 FeSe 薄膜内为张应力, 其中的暗点对应 Se 空位。图 6(a) 中亮条纹很可能对应着由于应力释放形成的畴界。我们还发现, 退火时间越长, 畴界越密集, Se 空位越多。这说明退火过程中发生 Se 脱附的同时, FeSe 与 STO 衬底间作用增强, 使薄膜电子性质改变, 并最终导致由绝缘体到超导体的转变^[2]。我们已利用非原位输运测量证实其超导转变温度高于 40 K ^[13]。

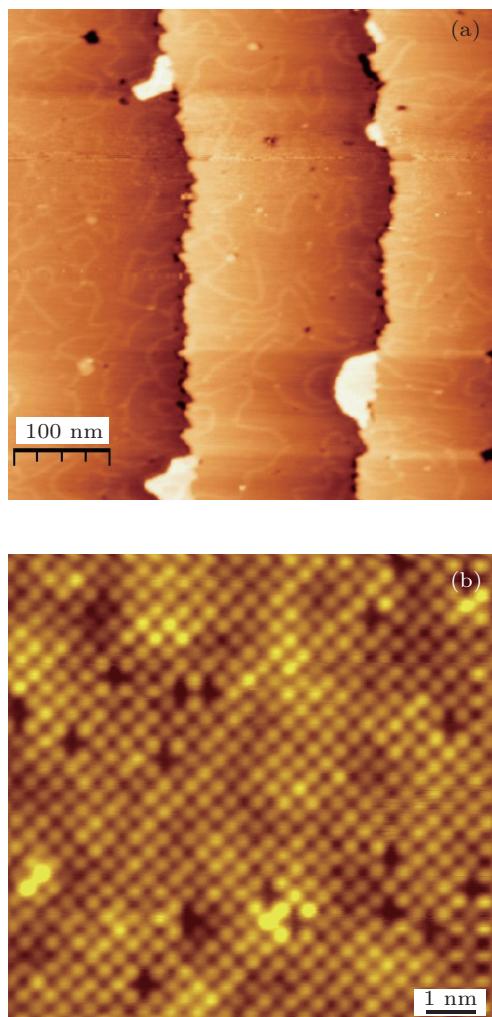


图 6 (a) 样品在真空中 430°C 的环境下退火 12.5 h 后的 STM 形貌像 (图像大小 $500\text{ nm} \times 500\text{ nm}$, 扫描条件 $V_{\text{bias}} = 1.5\text{ V}$, $I_t = 60\text{ pA}$); (b) FeSe 薄膜的原子分辨形貌像 (图像大小 $10\text{ nm} \times 10\text{ nm}$, 扫描条件 $V_{\text{bias}} = 0.1\text{ V}$, $I_t = 100\text{ pA}$)

4 FeSe 薄膜在 SrO 和 TiO_2 面上的选择性生长

FeSe 薄膜优先生长于 TiO_2 终止面。图 7 为在具有双终止面的 STO 衬底上制备的单层 FeSe 薄膜的扫描隧道显微镜形貌像。FeSe 在 TiO_2 面上形成连续的薄膜, 而在 SrO 面仅有少量 FeSe 团簇, SrO 面附近的 FeSe 多聚集于 SrO 面与 TiO_2 面的台阶边缘处的第一层 FeSe 之上, 从而形成第二层 FeSe 薄膜。由此可见, 制备具有单一 TiO_2 终止面的绝缘 $\text{SrTiO}_3(001)$ 衬底对生长高质量连续的单层 FeSe 薄膜至关重要。

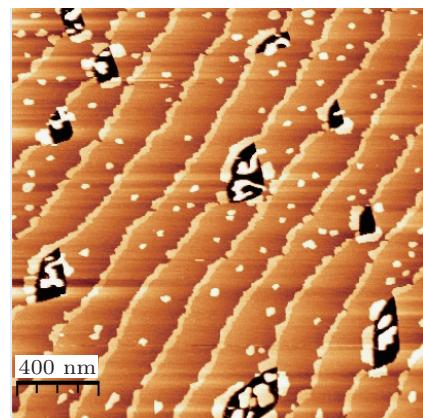


图 7 在存在大量双终止面的衬底上生长 FeSe 薄膜的 STM 形貌像 (图像大小 $2\text{ }\mu\text{m} \times 2\text{ }\mu\text{m}$, 扫描条件 $V_{\text{bias}} = 2.0\text{ V}$, $I_t = 60\text{ pA}$)

5 结 论

本文使用 HCl 溶液进行腐蚀以及在退火过程中精确控制氧气的流量, 获得了台阶有序、具有单一 TiO_2 终止的原子级平整表面的 $\text{SrTiO}_3(001)$ 表面。在此基础上, 通过精确控制 Fe 源、Se 源和衬底温度, 实现了对生长动力学的控制, 制备出大面积均匀连续并具有理想化学配比的单层 FeSe 单晶薄膜。进一步的退火可以增强 FeSe 薄膜的结晶性, 减少薄膜表面缺陷。更重要的是, 退火过程增强了 FeSe 与 STO 衬底间的电荷转移, 从而获得了具有超导性质的薄膜。

参考文献

- [1] Wang Q Y, Li Z, Zhang W H, Zhang Z C, Zhang J S, Li W, Ding H, Ou Y B, Deng P, Chang K, Wen J, Song C L, He K, Jia J F, Ji S H, Wang Y Y, Wang L L, Chen X, Ma X C, Xue Q K 2012 *Chin. Phys. Lett.* **29** 037402
- [2] He S L, He J F, Zhang W H, Zhao L, Liu D F, Liu X, Mou D X, Ou Y B, Wang Q Y, Li Z, Wang L L, Peng J

- P, Liu Y, Chen C Y, Yu L, Liu G D, Dong X L, Zhang J, Chen C T, Xu Z Y, Chen X, Ma X C, Xue Q K, Zhou X J 2013 *Nat. Mater.* **12** 605
- [3] Saint-James D, de Gennes P G 1963 *Phys. Lett.* **7** 306
- [4] Ginzburg V L 1964 *Phys. Lett.* **13** 101
- [5] Wang L L, Ma X C, Chen X, Xue Q K 2013 *Chin. Phys. B* **22** 086801
- [6] Unoki H, Sakudo T 1967 *J. Phys. Soc. Jpn.* **23** 546
- [7] Muller K A, Berlinger W, Waldner F 1968 *Phys. Rev. Lett.* **21** 814
- [8] Kawasaki M, Takahashi K, Maeda T, Tsuchiya R, Shinozaki M, Ishiyama O, Yonezawa T, Yoshimoto M, Koinuma H 1994 *Science* **266** 1540
- [9] Koster G, Kropman B L, Rijnders G J H M, Blank D H A, Rogalla H 1998 *Appl. Phys. Lett.* **73** 2920
- [10] Biswas A, Rossen P B, Yang C H, Yang C H, Siemons W, Jung M H, Yang I K, Ramesh R, Jeong Y H 2011 *Appl. Phys. Lett.* **98** 051904
- [11] Wang X, Fei Y Y, Lü H B, Jin K J, Zhu X D, Chen Z H, Zhou Y L, Yang G Z 2005 *Sci. China Ser. G-Phys. Mech. Astron.* **35** 158 (in Chinese)[王旭, 费义艳, 吕惠宾, 金奎娟, 朱湘东, 陈正豪, 周岳亮, 杨国桢 2005 中国科学 **35** 158]
- [12] Chambers S A, Droubay T C, Capan C, Sun G Y 2012 *Surf. Sci.* **606** 554
- [13] Zhang W H, Sun Y, Zhang J S, Li F S, Guo M H, Zhao Y F, Zhang H M, Peng J P, Xing Y, Wang H C, Fujita T, Hirata A, Li Z, Ding H, Tang C J, Wang M, Wang Q Y, He K, Ji S H, Chen X, Wang J F, Xia Z C, Li L, Wang Y Y, Wang J, Wang L L, Chen M W, Xue Q K, Ma X C 2014 *Chin. Phys. Lett.* **31** 017401

Molecular beam epitaxy of single unit-cell FeSe superconducting films on SrTiO₃(001)^{*}

Wang Meng^{1,3)} Ou Yun-Bo³⁾ Li Fang-Sen^{2,3)} Zhang Wen-Hao^{2,3)} Tang Chen-Jia^{2,3)}
 Wang Li-Li^{2,3)} Xue Qi-Kun^{2)†} Ma Xu-Cun^{2,3)‡}

1) (School of Electronic Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

2) (State Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Physics, Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

3) (State Key Laboratory for Surface Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

(Received 1 December 2013; revised manuscript received 11 December 2013)

Abstract

Based on our previous work, we have systematically investigated the molecular beam epitaxy growth of single unit-cell FeSe films on SrTiO₃(001) substrates and studied the surface morphology by scanning tunneling microscopy. We found that there are three key steps to obtain large-scale uniform one unit-cell superconducting FeSe films. First, the STO(001) substrates should be treated by HCl etching and thermal annealing under oxygen flux so that a specific TiO₂-terminated STO(001) surface with well-defined step-terrace structure could be obtained. Second, the Fe and Se fluxes and substrate temperature have to be controlled delicately. At last, post-growth annealing is also critical, which can remove extra Se adatoms, and more importantly facilitate the necessary electron transfer for superconductivity transition.

Keywords: SrTiO₃(001), single unit-cell FeSe films, high temperature superconductivity, molecular beam epitaxy

PACS: 74.78.-w, 77.80.bn, 68.35.Ct

DOI: 10.7498/aps.63.027401

* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11374336, 91121004).

† Corresponding author. E-mail: qkxue@mail.tsinghua.edu.cn

‡ Corresponding author. E-mail: xcma@iphy.ac.cn